

04

© 1991 г.

РАЗВИТИЕ ПУЧКОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ИНЖЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО СГУСТКА В СЛАБОИОНИЗОВАННУЮ ПЛАЗМУ В УСЛОВИЯХ ПРОБОЯ

П. В. Веденин

Исследовано влияние лавинообразной наработки плазмы на динамику пучковой неустойчивости, возбуждаемой передним фронтом электронного сгустка. Показано, что при транспортировке сгустков с длительностью, превышающей обратное характерное время развития лавины ионизации, через слабоионизованную плазму амплитуда поля, возбуждаемого в хвостовой части сгустка, значительно уменьшается по сравнению со случаем, когда наработка плазмы отсутствует.

Введение

Развитие пучковой неустойчивости, возбуждаемой передним фронтом электронного пучка или одиночного электронного сгустка при инжекции в холодную плазму, обладает рядом специфических особенностей. Выявлению этих особенностей в предположении, что концентрация плазмы изменяется незначительно и не может заметно сказаться на динамике процесса, посвящены работы [1-5]. Влияние наработки плазмы в рамках задачи нестационарной инжекции впервые учтено в [6]. Однако авторы рассмотрели ситуацию, в которой нарастание концентрации плазмы происходит лишь вследствие ударной ионизации пучковыми электронами (т. е. достаточно медленно, поскольку предполагалось, что $n_b \ll n_p$, где n_b , n_p — невозмущенные концентрации электронов пучка и плазмы соответственно), причем ограничились изучением линейной стадии.

В данной работе на основе решения модельной задачи предпринята попытка качественного исследования динамики пучковой неустойчивости в условиях лавинообразного нарастания концентрации плазмы в возбуждаемом сгустком электрическом поле (сюда же относится и ионизация обратным током).

1. В момент времени $t=0$ в полупространство $z \geq 0$, заполненное холодной однородной плазмой с плотностью электронов n_{p0} , начинается инжекция прямогоугольной формы импульса тока длительности t_b . В плоскости инжекции $z=0$ задана плотность пучкового тока $j_b = ev_0 n_b$, причем $n_b \ll n_p$. Для рассматриваемых быстропеременных процессов возмущением ионов плазмы пренебрегаем. Условие линейности плазмы получим позже при анализе нелинейной стадии неустойчивости. В данной работе ограничимся рассмотрением одномерного приближения, что верно, если $((\omega_{p0}a)/c)^2 \gg 1$, где $\omega_{p0}^2 = (4\pi e^2 n_{p0})/m$, a — характерный поперечный размер системы.

Описывать рост концентрации плазмы будем с помощью простейшего уравнения

$$\frac{\partial n_p}{\partial \tau} = 2v_{i*}(W)n_p, \quad (1)$$

где $v_{i*}(W) = (v_i/(2\omega_{p0}))$ — безразмерная постоянная развития лавины ионизации, зависящая от энергии электронов W ; $\tau = t - (z/v_0)$.

Уравнение (1) справедливо при пренебрежении локальными потерями электронов и для пространственных масштабов, существенно превышающих длину

ионизации в газе электронным ударом. Вклад пучковых электронов в наработку плазмы пренебрежимо мал.

Имея в виду выяснение качественного поведения пучково-плазменной системы, примем $v_i(W) = \Gamma \eta(W - W_c)$, где $\eta(x) = \begin{cases} 1 & x > 0, \\ 0 & x < 0, \end{cases}$ $\Gamma = \text{const}$; W_c — значение энергии, при котором начинается пробой. Кроме того, будем считать, что частота транспортных столкновений v электронов плазмы с нейтралами также постоянна. Сделанные предположения оправданы, например, для гелия в диапазоне энергий плазменных электронов $4 \leq W \leq 100$ эВ [7-11].

В результате подстановки в неравенства $W > W_c$, $W_{t \min}$ (при $W_{t \max} \geq W \geq W_{t \min}$ можно положить $v = \text{const}$) оценки для энергии плазменных электронов вблизи переднего фронта сгустка ($W \sim \beta_0^2 mc^2 (n_b/n_{p0})^2$) получаем следующее ограничение на параметры пучково-плазменной системы:

$$\beta_0 \frac{n_b}{n_{p0}} > 1.5 \cdot 10^{-3} \sqrt{\max\{W_0, W_{t \min}\}}, \quad (2)$$

где $\beta_0 = v_0/c$.

Завершая обсуждение границ применимости используемой модели, отметим, что в диапазоне энергий плазменных электронов $W_c, W_{t \min} \leq W \leq 100$ эВ справедливо неравенство $v \gg \Gamma$, для гелия $v/(\max\{v_i(W)\}) \approx 3$.

2. Учет зависимости $n_p(\tau)$ практически не вносит дополнительных трудностей (по сравнению с [1, 4]) в процедуру нахождения выражения для возбуждаемого в результате развития неустойчивости продольного электрического поля, поэтому сразу запишем

$$\begin{aligned} E(\tau, \xi) &\simeq E_A(\tau, \xi) \sin \Phi(\tau, \xi), \\ \Phi(\tau, \xi) &= \sqrt{1 - v_*^2} G(\tau) - \chi(\tau, \xi) + \frac{\pi}{12}, \quad v_* = \frac{v}{2\omega_{p0}}, \\ G(\tau) &= \int_0^\tau d\tau' \omega_p(\tau') = \frac{\exp(\Gamma_* \tau) - 1}{\Gamma_*}, \quad \xi = \frac{\omega_p \tau}{v_0}, \quad \gamma_0 = (1 - \beta_0^2)^{-1/2}, \quad \chi(\tau, \xi) = \\ &= \frac{3}{4} [\xi^2 G(\tau)]^{1/2}, \\ E_A(\tau, \xi) &= E_0 \exp \left\{ \sqrt{3} \chi(\tau, \xi) - \left(v_* + \frac{\Gamma_*}{2} \right) \tau \right\} / \sqrt{8\pi \chi(\tau, \xi)}, \\ E_0 &= \frac{4\pi |e| v_0 n_b}{\omega_{p0}}. \end{aligned} \quad (3)$$

Формула (3) справедлива в области значений

$$\frac{4}{3} G^{-1/2}(\tau) \ll \xi^{1/2} \ll G^{1/2}(\tau). \quad (4)$$

Как показано в [5], при $v > 0.2 \omega_{p0}$ ($v_* > 0.1$) определяющую роль в динамике сгустка играет низкочастотное поле $E(\tau, \xi) \sim 2v_* E_0$, а поскольку нас интересует влияние наработки плазмы только на динамику неустойчивости, то везде в дальнейшем будем считать $v_* \leq 0.1$.

В данной работе ради удобства мы изменим традиционный порядок рассмотрения и остановимся вначале на нелинейной стадии. При анализе нелинейной стадии будем пользоваться понятием цуга-участка волны, на котором фаза колебаний меняется на 2π . Как и в случае $\Gamma=0$,

$$\frac{\partial \chi(\tau, t)}{\partial \tau} \ll \frac{dG}{d\tau},$$

т. е. $\partial\Phi/\partial\tau \simeq dG/d\tau$. Последнее неравенство вытекает из условий слабого релятивизма

$$\beta_0^2 \gamma_0^2 \frac{\Delta v}{v_0} \ll 1$$

и линейности плазмы (о них речь пойдет ниже). Фазовая скорость v_{ph} (τ , ξ) щуга τ

$$v_{ph}(\tau, \xi) = v_0 \left\{ 1 - \frac{\omega_b}{2\omega_{p0}} \left[\frac{G(\tau)}{\xi} \right]^{1/2} e^{-\Gamma_* \tau} \right\} \quad (5)$$

зависит только от координаты ξ . Обращает на себя внимание факт экспоненциально быстрого спадения функции $\Delta v(\tau) \equiv v_0 - v_{ph}$ с ростом τ в области $\Gamma_* \tau > 1$. Поскольку для каждого отдельного щуга можно считать, что насыщение неустойчивости происходит в результате захвата пучковых электронов в соответствующую потенциальную яму, то амплитуда насыщения $E_s(\tau)$, пропорциональная Δv^2 , в указанной области также должна быстро уменьшаться.

Нелинейная стадия начинается в момент времени t_{s0} на щуге τ_0 . При $t > t_0$ прекращается рост амплитуды поля в некоторой области. С течением времени эта область расширяется, постепенно захватывая весь густок. Приближенные выражения для дистанции $z_s(\tau)$, на которой происходит захват частиц щуга τ , соответствующего момента времени $t_s(\tau)$ и амплитуды насыщения $E_s(\tau)$, имеют вид

$$z_s(\tau) \simeq \frac{8}{3^{1/4}} \frac{v_0}{\omega_b} \sqrt{\frac{F^s(\tau)}{G(\tau)}}, \quad (6)$$

$$\tau_s(\tau) = \frac{\tau}{\omega_{p0}} + \frac{z_s(\tau)}{v_0}, \quad (7)$$

$$E_s(\tau) \simeq \mu E_0 e^{-2\Gamma_* \tau} \frac{G(\tau)}{F(\tau)}, \quad (8)$$

где $F(\tau) \simeq F_0(\tau) + (1/2) \ln [(27\sqrt{3}\pi)/(8F_0(\tau))]$, $F_0(\tau) \simeq \ln G(\tau) + (\nu_* + (\Gamma_*/2)) \tau$, μ — подгоночный параметр (в случае $\Gamma=0$, как выявили численные расчеты [3, 4], $\mu \simeq 1.7$).

Исследование показало, что (6)–(8) справедливы, когда выполнены условия

$$\beta_0^2 \sqrt{\frac{n_b \gamma_0 E_{sm}}{n_p \mu E_0}} \ll 1 \quad (9)$$

и

$$\frac{n_b}{n_p} e^{-\Gamma_* \tau_{mm}} \frac{E_{sm}}{E_0} \ll 1, \quad (10)$$

где $E_{sm} = E_s(\tau = \tau_{mm}) = \max \{E_s(\tau)\}$, гарантирующие соответственно возможность рассмотрения слаборелятивистского предела и плазмы как линейной среды.

В области $\tau > \tau_{min}$ (τ_{min} определяется из условия $\propto [\tau, \xi_s(\tau)] \gg 1$) функция $E_s(\tau)$ максимальна в сечении τ_{mm} , если $\Gamma_* < \Gamma_{*max} = (4e^{3/2})^{-1}$ или монотонно спадает при выполнении обратного неравенства. Второй случай, впрочем, мы рассматривать не будем, поскольку он выходит за поставленные ранее рамки ($0.1 \gg \nu_* \gg \Gamma_*$). Выражения для τ_{mm} и $E_{sm}(\tau_{mm})$ имеют соответственно вид

$$\tau_{mm} \simeq \left(\Gamma_* + \sqrt{\frac{3\nu_* \Gamma_*}{\ln \frac{1}{\nu_* \Gamma_*}}} \right)^{-1} < \Gamma_*^{-1}, \quad (11)$$

$$E_{sm}(\tau_{mm}) \simeq \mu \frac{E_0}{\nu_* + \Gamma_*} \frac{1 - 1.5\Gamma_* \tau_{mm}}{1 + \frac{\ln \tau_{mm}}{\nu_* \tau_{mm}}} < \mu \frac{E_0}{\nu_*}. \quad (12)$$

После подстановки (12), (13) в (10), (11) и последующего совместного с (2) анализа приходим к выводу, что предложенная модель применима к пучково-плазменным системам с параметрами

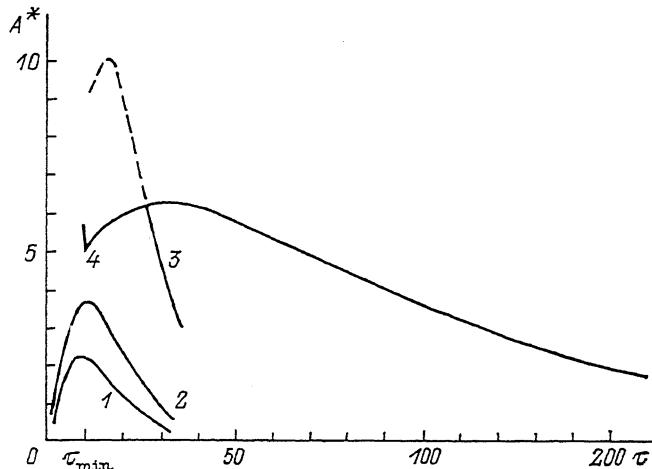
$$\gamma_0 \sim 1, \quad 10^{-3} \leq \frac{n_b}{n_p} \leq 10^{-2}; \quad 10^{-2} \leq v_* \leq 10^{-1} \quad (13)$$

Кроме того, естественно, необходимо выбрать сорт газа в соответствии с требованиями, указанными в разделе 1.

Коротко остановимся на описании линейной стадии. В области (13)

$$\delta = \frac{\sqrt{3} \omega_{p0}}{2\gamma_0} \left(\frac{n_b}{2n_{p0}} \right)^{1/2} > \frac{v}{2} \gg \frac{\Gamma}{2}$$

и неустойчивость вплоть до момента времени t_{s0} (начало стадии насыщения) определяемого из уравнения $\delta t_{s0} \approx \ln((\omega_{p0} t_{s0})/3)$, развивается также, как и



в случае $\Gamma=0$ [1, 2]. Максимальное в координате $z_m(t) \approx (2/3) v_0 t$ (при $v/2 \ll \delta$) поле нарастает экспоненциально с инкрементом δ . С ростом частоты транспортных столкновений скорость перемещения максимальной амплитуды увеличивается, а сама амплитуда падает.

На рисунке представлена динамика амплитуды поля в случае $\Gamma_* = 10^{-2}$, $n_b/n_{p0} = 10^{-2}$, $v_* = 8 \cdot 10^{-2}$, $\gamma_0 = 2$, $\mu = 2$. Кривые 1—3 построены по формуле линейной теории $(E_A(\tau, t))/E_0$ в моменты времени $t_* = 50, 60, 80$ соответственно, а кривая 4 относится к стадии насыщения $(E_s(\tau))/E_0$. Нелинейная стадия начинается в момент времени $t_{s0} \approx 65 \omega_{p0}^{-1}$, когда

$$E_A[z_m(t_{s0}), t_{s0}] \approx E_s \left[\tau_m = \omega_{p0}^{-1} \left(t_{s0} - \frac{z_m(t_{s0})}{v_0} \right) \right].$$

При $t > t_{s0}$ амплитуда поля A в области $\tau_{min} < \tau \leq \tau_1(t)$ (в сечении τ_1 справедливо соотношение $E_A(t_*, \tau_1) \approx E_s(\tau_1)$) удовлетворяет условию $A(\tau, t) \leq E_s(\tau)$, а в области $\tau > \tau_1$ $A(\tau, t) = E_A(\tau, t)$.

3. Завершая работу подчеркнем основной результат. При транспортировке электронных сгустков с длительностью, превышающей обратное характерное время развития лавины ионизации, через слабопонизованную плазму с параметрами, удовлетворяющими условиям (13), амплитуда поля, возбуждаемого в хвостовой части сгустка, значительно уменьшается по сравнению со случаем $\Gamma=0$. В результате должны заметно улучшиться условия транспортировки такого сгустка.

Автор благодарит О. А. Гордеева за ценные замечания и Н. Е. Розанова за плодотворные дискуссии.

Список литературы

- [1] Рухадзе А. А., Рухлин В. Г., Северьянов В. В. // Физика плазмы. 1978. Т. 4. № 2. С. 463—467.
- [2] Рухадзе А. А., Рухлин В. Г., Северьянов В. В. // Кр. сообщ. по физике. М., 1978. № 10. С. 23—26.

- [3] Веденин П. В., Рухлин В. Г., Тараканов В. П. // Физика плазмы. 1989. Т. 25. № 10. С. 1246—1250.
- [4] Веденин П. В. // ЖТФ. 1990. Т. 60. Вып. 11. С. 57—65.
- [5] Веденин П. В. // ЖТФ. 1991. Т. 61. Вып. 6. С. 51—59.
- [6] Гусеева Г. И., Рухадзе А. А., Рухлин В. Г. // ЖТФ. 1979. Т. 49. Вып. 12. С. 2535—2539.
- [7] Арутюнян С. Г., Рухадзе А. А. // Физика плазмы. 1979. Т. 5. № 3. С. 702—704.
- [8] Арутюнян С. В., Геккер И. Р., Карабидов Д. М., Рухадзе А. А. Препринт ФИАН СССР. № 5. М., 1979. 12 с.
- [9] Арутюнян С. Г., Рухадзе А. А. // Кр. сообщ. по физике. М., 1978. № 9. С. 12—18.
- [10] Арутюнян С. Г., Игнатьев А. В., Рухадзе А. А. // Кр. сообщ. по физике. М., 1980. № 7. С. 17—23.
- [11] Мак-Дональд А. // Сверхвысокочастотный пробой в газах. М.: Мир, 1969. 212 с.

Московский
радиотехнический институт
АН СССР

Поступило в Редакцию
11 ноября 1990 г.
В окончательной редакции
5 мая 1991 г.